

整理番号 2002-0464
 発送番号 227598
 発送日 平成18年 6月 6日

拒絶理由通知書

特許出願の番号	特願2002-291304
起案日	平成18年 5月29日
特許庁審査官	▲高▼場 正光 2910 2W00
特許出願人代理人	長谷川 芳樹(外 2名) 様
適用条文	第29条第2項

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものである。これについて意見があれば、この通知書の発送の日から60日以内に意見書を提出して下さい。

理 由

この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前日本国内又は外国において頒布された下記の記事に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

記 (引用文献等については引用文献等一覧参照)

1. 請求項1～3, 5～7/引用文献1, 2/

引用文献1には、位相物体による波面の歪みを2次元的に測定するために、
 - マトリックス状に配置されたマイクロレンズアレイと、
 - 該マイクロレンズアレイの焦点位置に設けられる拡散スクリーンと、
 - 該拡散スクリーンに結像した複数のスポット光を検出するCCDカメラと、
 - 前記輝度がしきい値を超えて(明細書第30頁第2段落)極大となる位置を検出してスポットを特定する収縮処理、および該極大となる位置周辺の領域から輝度の重心位置(同書第33頁第4段落で言及される、第27頁の式12a, 12bを参照のこと)を特定する処理を行う演算処理装置とを用いることが記載されている(同書第16頁第6行～第25行、第29頁第17行～第33頁第33行、第13, 18～20図)。

このような波面の歪みを測定する装置が、位相分布の計測に用いられることは、例えば引用文献2の【0003】に記載されているとおり周知の知見であり、特に当該引用文献2には、しきい値を超える画素のみに基づいて重心位置を求めることが記載されている(【0027】～【0030】)。

2. 請求項4/引用文献1～3/

引用文献3には、画像処理として周知の平滑化処理が記載されている(【0010】)。

引用文献等一覧

1. 国際公開第95/34800号パンフレット
2. 特開2000-283853号公報
3. 特開平08-263650号公報

この拒絶理由通知に関する問い合わせ先:

特許審査第一部 材料分析 高場正光
 TEL 03-3581-1101 内線 3292
 FAX 03-3592-8858

この拒絶理由通知書中で指摘した点以外については、現時点では、拒絶の理由を発見しない。拒絶の理由が新たに発見された場合には拒絶の理由が通知される。

6/7小貫



先行技術文献調査結果の記録

・調査した分野

G 0 1 J 9 / 0 0 - 9 / 0 4

W P I

この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではない。